

# ARECプラザ 第117回リレー講演会

## 画像処理・光学分野

日時：2010年10月21日(木) 15:00~18:00

終了後、交流会 [参加費：無料]

場所：AREC (上田市産学官連携支援施設) 4階

(上田市常田 3-15-1 信州大学繊維学部内 Tel: 0268-21-4377)

### 講演1

15:00~16:00

**演題** 『画像処理による欠陥検査のための各種フィルタリングテクニック』

**講師** 信州大学工学部 情報工学科 助教 白井 啓一郎 氏

**概要** 欠陥検査用の画像処理では、ノイズ除去およびエッジ抽出のためのフィルタ処理が重要な役割を果たし、特殊パターンを持つ基盤画像に対しては特殊なフィルタ形状を用いたり、また高速に動作させるために近似フィルタを用いたりする。本講演ではこのようなフィルタリングテクニックの紹介と、開発を円滑に行うための画像処理用ライブラリなどを紹介する。

### 講演2

16:00~17:00

**演題** 『ディスプレイの色はどこまで鮮やかになればいいのか?』

**講師** セイコーエプソン株式会社 技術開発本部 IT技術開発センター 主任 金井 政史 氏

**概要** 先日発表されたシャープの4原色液晶テレビ「AQUOS クアトロン」を始め、より鮮やかな色が出せる「広色域」を売りとしたカラー機器が数多く発表されてきている。広色域化により見た目は美しくなるが、コストもかかる中でどこまで鮮やかになれば十分なのだろうか? 「広色域」に関する技術動向をレビューした上で、感性工学の観点で人間にとってカラー機器に必要な色の範囲を求めた信州大学との共同研究の結果を紹介する。

休憩 10分

### 講演3

17:00~18:00

**演題** 『プリント配線板の外観検査について』

**講師** 日置電機株式会社 技術本部 ATE部 技術8課長 松井 隆一 氏

**概要** 当社では部品実装前のプリント配線板の最終出荷前の外観不良を検出する外観検査装置を開発設計から製造販売まで行っている。近年プリント配線板が高密度・微細化しており検査基準も厳しくしかも高速処理が求められている。それらの要求を満たすために用いている照明技術、過検出を抑え検出力を上げるためのソフト技術/テクニックなどを紹介する。

### お申込先

ARECプラザ宛 メール ([mousikomi@arecplaza.jp](mailto:mousikomi@arecplaza.jp)) またはファックス (0268-21-4382) でお申し込みください。

ARECプラザ 第117回リレー講演会 参加申込書		[2010年10月21日(木)]	
企業・機関名			
参加者名			
所属・役職	電話番号		
メールアドレス	ファックス番号		

ご記入いただいた個人情報(御社名、所属 役職、氏名)は受付名簿としてのみ使用し、他の用途には一切利用いたしません。